



Training AFM: Microscopia a FORZA ATOMICA

A cura del Prof. Gianpiero Buscarino

Per gli utenti UNIPA il training è gratuito; esso è dedicato a studenti di dottorato e giovani ricercatori dell'Università degli studi di Palermo che vogliono acquisire nuove conoscenze sulla microscopia a forza atomica (AFM) e sulla sua applicazione per l'analisi di superfici di campioni solidi o nano-sistemi 0D, 1D e 2D depositati su substrato (sistemi biologici, semiconduttori, metalli, isolanti, polimeri, carbon dots). Le attività sono volte a fornire una formazione teorico pratica sui fondamenti di questa tecnica ed allo svolgimento di esperimenti reali. Il training sarà tenuto interamente a distanza attraverso la piattaforma TEAMS. Per gli utenti esterni ad UNIPA il training prevede un contributo pari a 150 euro per utenti di enti pubblici di ricerca e 250 euro per soggetti privati (aziende).

Programma

09:00 - 13:00 Introduzione alla tecnica di microscopia a forza atomica ed alla relativa strumentazione. Preparazione dei campioni.

14.00 - 17.30 Training pratico su Bruker FAST-SCAN Bio

Saranno presentate analisi sia su superfici di campioni solidi che su nano-sistemi depositati su substrato.

Iscrizione: Verranno prese in considerazione le richieste che hanno come **oggetto: training AFM**. Nella richiesta di iscrizione specificare i dati del partecipante ed eventualmente il corso di dottorato, relativo ciclo e il nome del tutor.

N.B.: La fruizione del training è propedeutica all'uso della strumentazione Bruker FAST-SCAN Bio in modalita' free-service. Qualora un partecipante volesse analizzare un campione proveniente dal proprio laboratorio è pregato di contattarci con anticipo per concordare i dettagli sulla preparazione dello stesso. Tale attività prevede un contributo pari a 30 euro/campione.

Laboratorio di
Superfici, Film
Sottili e
Dispositivi

13 Gennaio 2021

ATEN CENTER
Viale Delle Scienze
Edificio 18

prenotazioni aperte
fino al

10 gennaio 2021

email:
eventi.aten@unipa.it

info training:
gianpiero.buscarino@unipa.it